



产品特点:

损耗测试

- 测试长度最长70m
- 空间分辨率高达20um
- 回损测试灵敏度可达-130dB
- 回损测试动态范围80dB
- 插损测试动态范围15dB
- 可提供全套硬、软件解决方案

传感测试

- 测试长度最长100m
- 空间分辨率最高可达1mm@50m
- 可提供全套硬、软件解决方案

典型应用:

- 光子芯片传输损耗测量
- 芯片内损耗事件定位分析
- 芯片内光链路延时测量
- 分布式光纤应变&温度传感
- 3D光纤形状传感系统研发
- 产线规模化测试方案

TranCT-215 可用于光链路传输损耗测量，具有超高的损耗测试动态范围和灵敏度，超高的空间分辨率和损耗定位精度。该系统可选配光纤传感功能软件，从而使该系统实现多通道同时采集、分布式光纤应变及温度测量功能。

技术指标	单位	TranCT-215
损耗测试		
中心波长	nm	1550
扫描范围	nm	40
波长精度	pm	0.1
光链路测试长度	m	70
空间分辨率	um	20
回损测量范围	dB	0~-125
回损灵敏度	dB	-130
回损动态范围	dB	80
回损测量分辨率	dB	0.1
回损测量精度	dB	±0.5
插损动态范围	dB	15
插损分辨率	dB	0.1
插损精度	dB	±0.2
测试频率	Hz	1
传感测试		
空间分辨率	mm	1@50m, 10@100m
应变测量范围	uε	±15000
应变测量精度	uε	±5
温度测量范围	℃	-200~1200
温度测量精度	℃	±0.2
测试通道数	-	标准1, 可定制
单次测试时间	s	5



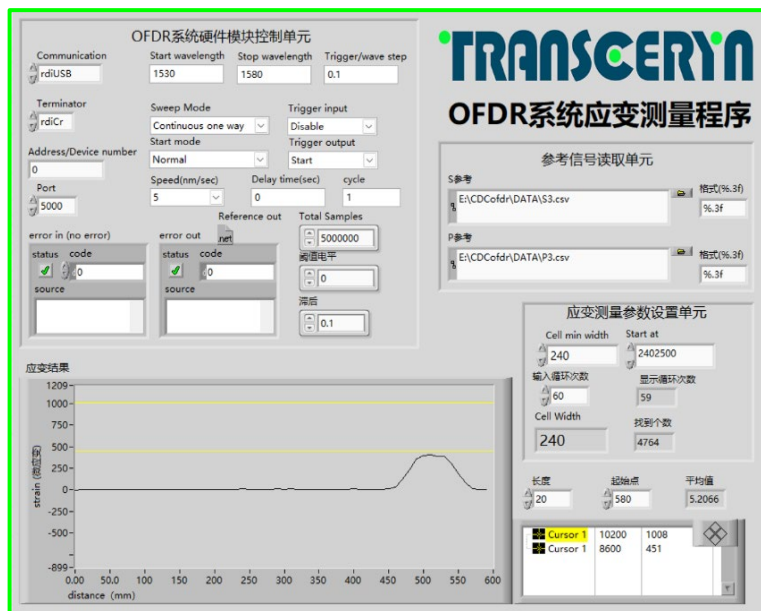
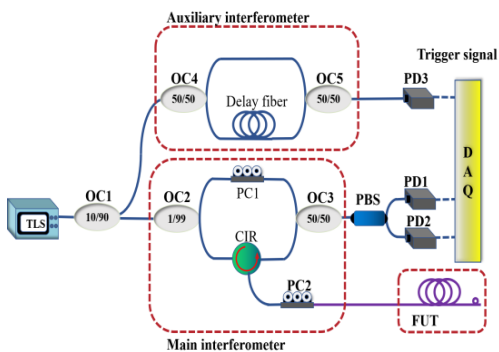
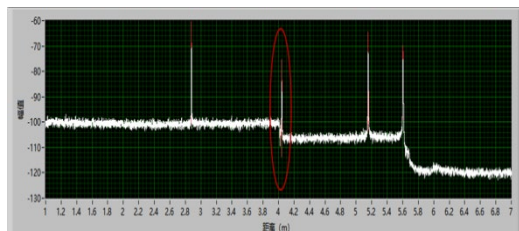
OFDR系统搭建整套硬、软件解决方案

我们能够提供**系统硬件搭建、软件算法及源代码、定制化应用软件开发**等**整套**技术解决方案。

硬件方案特点：提供核心模块&器件选择、测试系统搭建、整机系统集成

软件方案特点：提供核心算法及程序源代码、交互界面辅助设计、应用软件开发

□ 损耗测试功能



□ 传感测试功能

